

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

5.1.1 ผลของอัตราส่วนโดยโมลของเอซีทิลอะซีโนนต่อไทเทเนียมไดออกไซด์และจำนวนรอบในการเคลือบต่อลักษณะและประสิทธิภาพในการขัดฟันกล

การยึดเกาะของไทเทเนียมไดออกไซด์บนพอลิเมทิลเมทาคริเลตขึ้นกับอัตราส่วนโดยโมลของเอซีทิลอะซีโนนต่อไทเทเนียมไดออกไซด์ ($ACATiO_2$) โดยการเพิ่ม $ACATiO_2$ ทำให้ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมได้มีความเรียบและเป็นเนื้อดียกันมากขึ้นเนื่องจากเอซีทิลอะซีโนนช่วยเพิ่มความมีข้าวและภาวะติดบนผิวของพอลิเมอร์ ส่วนจำนวนรอบในการจุ่มเคลือบสารละลายไทเทเนียมไดออกไซด์บนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตต่อปริมาณไทเทเนียมไดออกไซด์บนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลต พบว่าจำนวนรอบในการเคลือบ 1 และ 3 รอบ ส่งผลให้ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมได้มีความเรียบและเป็นเนื้อดียกัน แต่เมื่อเพิ่มจำนวนรอบในการเคลือบเป็น 5 และ 10 รอบ ส่งผลให้ฟิล์มบางที่เตรียมได้มีรอยแตกและรูพรุนเกิดขึ้นบนผิวของฟิล์มทั้งนี้อาจเกิดจากภาระเหยื่อของตัวทำละลายและเอซีทิลอะซีโนน

ผลของอัตราส่วนโดยโมลของเอซีทิลอะซีโนนต่อไทเทเนียมไดออกไซด์และจำนวนรอบในการจุ่มเคลือบสารละลายไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อประสิทธิภาพในการขัดฟันกล พบว่า การเพิ่มอัตราส่วนของเอซีทิลอะซีโนนต่อไทเทเนียมไดออกไซด์ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขัดฟันกลเพิ่มขึ้น อัตราส่วนโดยโมลของเอซีทิลอะซีโนนต่อไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ 3.0 ให้ประสิทธิภาพในการขัดฟันกล 62.5% ทั้งนี้เนื่องมาจากเอซีทิลอะซีโนนช่วยเพิ่มความมีข้าวของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ไปยังผิวของพอลิเมทิลเมทาคริเลตทำให้ไทเทเนียมเกาะติดบนผิวของพอลิเมทิลเมทาคริเลตมากขึ้น สำหรับผลของจำนวนรอบในการเคลือบสารละลายไทเทเนียมไดออกไซด์บนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่ $ACATiO_2$ เท่ากับ 3.0 พบว่าจำนวนรอบในการจุ่มเคลือบมากขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขัดฟันกลเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณไทเทเนียมไดออกไซด์บนตัวรองรับมากขึ้นเมื่อความหนาของฟิล์มเพิ่มขึ้น และพบว่าจำนวนรอบในการจุ่มเคลือบท่ากับ 5 รอบ มีประสิทธิภาพในการขัดฟันกลได้มากที่สุดถึง 68.5%

5.1.2 ผลของอุณหภูมิในการเผาไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อประสิทธิภาพในการขัดฟันอล

รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของไทเทเนียมไดออกไซด์ก่อนและหลังผ่านการเผาที่อุณหภูมิในช่วง 400-800 องศาเซลเซียส พบร่วมไทเทเนียมไดออกไซด์ก่อนการเผาและหลังการเผาที่อุณหภูมิ 400-800 องศาเซลเซียส มีโครงสร้างผลึกแบบผสมระหว่างสันฐานแบบอนาเทสและรูไทล์ในอัตราส่วนที่แตกต่าง ส่วนระดับการสลายฟันอลที่ 5 ชั่วโมง พบร่วมไทเทเนียมไดออกไซด์ Degussa P-25 ประกอบด้วยสันฐานแบบอนาเทส/รูไทล์เท่ากับ 70/30 โดยน้ำหนัก เมื่อเผาไทเทเนียมไดออกไซด์ที่อุณหภูมิสูงถึง 700 องศาเซลเซียสทำให้สันฐานแบบอนาเทสเปลี่ยนไปเป็นรูไทล์ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีความกว้างไว้ต่ำกว่าแบบอนาเทส โดยระดับการสลายฟันอลของไทเทเนียมไดออกไซด์ลดลง 23.4% ภายหลังการเผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส

5.1.3 ผลของจำนวนแผ่นพอลิเมธิลเมทาคริเลตที่เคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ต่ออัตราการสลายตัวของฟันอล

ผลของจำนวนแผ่นพอลิเมธิลเมทาคริเลตต่อค่าคงที่ปรากฏของอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสง พบร่วมอัตราการสลายฟันอลเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มจำนวนแผ่นเมธิลเมทาคริเลตที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มนบางไทเทเนียมไดออกไซด์มากขึ้น เนื่องจากการเพิ่มแผ่นพอลิเมธิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นการเพิ่มจำนวน active sites ในการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่าความหนาแน่นของตัวเร่งปฏิกิริยาต่อพื้นที่การชายแสวงมากขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขัดฟันอลสูงขึ้น

5.1.4 ผลของค่าความเป็นกรด-เบสต่ออัตราการสลายตัวของฟันอล

ผลของค่าความเป็นกรด-เบสต่อค่าคงที่ปรากฏของอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสงของฟันอล พบร่วมเมื่อค่าความเป็นกรด-เบสสูงขึ้นช่วยเพิ่มอัตราการสลายฟันอลสูงสุด ในช่วงค่าความเป็นกรด-เบสเท่ากับ 5 เนื่องจากค่าความเป็นกรด-เบสของสารละลายเท่ากับ 5 ผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาจะมีประจุเป็นบวก ขณะที่ฟันอลแตกตัวแล้วจะมีประจุเป็นลบ สามารถถูกดูดซับบนผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาได้ ประสิทธิภาพการขัดฟันอลจึงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริเวณไกลผิวของ

อนุภาคไทยเนียมไดออกไซด์ มีค่าความหนาแน่นของอนุมูลไอลรอกซิลมากที่สุดส่งผลให้ปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสงของฟีนอล

5.1.5 ผลของความเข้มข้นเริ่มต้นของฟีนอลต่ออัตราการสลายตัวของฟีนอล

ผลของความเข้มข้นเริ่มต้นของฟีนอลต่อค่าคงที่ปรากฏของอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสงของฟีนอล พบร่วมกับอัตราการสลายฟีนอลลดลงเมื่อความเข้มข้นของฟีนอลเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราการสลายตัวขึ้นอยู่กับอนุมูลไอลรอกซิลบนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาและความเป็นไปได้ของอนุมูลไอลรอกซิลในการทำปฏิกิริยากับฟีนอล ดังนั้นมีความเข้มข้นของฟีนอลในสารละลายมีค่าสูง ทำให้ประสิทธิภาพในการจัดฟีนอลของไทยเนียมไดออกไซด์ลดลง เพราะฟีนอลจะเข้ามาดูดซับที่ผิวของไทยเนียมไดออกไซด์ในปริมาณมาก ทำให้อนุมูลไอลรอกซิลบนพื้นผิวของไทยเนียมไดออกไซด์ลดลงและแสงไม่สามารถเข้าถึงผิวของไทยเนียมไดออกไซด์

5.1.6 ผลของกำลังของหลอดอัลตราไวโอล็ेटต่ออัตราการสลายตัวของฟีนอล

ผลของกำลังของหลอดอัลตราไวโอล็ेटต่ออัตราการสลายตัวฟีนอลด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิง พบร่วมกับค่าคงที่ปรากฏของอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสงในการกำจัดฟีนอลมีค่าเพิ่มขึ้นตามกำลังของหลอดอัลตราไวโอล็ेट เนื่องจากการเพิ่มกำลังของหลอดอัลตราไวโอล็ेटช่วยเพิ่มอนุมูลไอลรอกซิลเหมือนกับการเติมไอลรอกซิล ลดการรวมตัวกันของอิเล็กตรอนกับหลุม จึงทำให้อัตราการสลายฟีนอลเพิ่มขึ้นที่กำลังของหลอดอัลตราไวโอล็ेटมากขึ้น

5.1.7 ผลของความเข้มข้นของไอลรอกซิลต่ออัตราการสลายตัวของฟีนอล

ผลของความเข้มข้นของไอลรอกซิลต่อค่าคงที่ปรากฏของอัตราการสลายตัวของฟีนอลด้วยอัลตราไวโอล็ेटต่อค่าคงที่ปรากฏของอัตราการสลายตัวของฟีนอลด้วยอัลตราไวโอล็ेटต่อค่าคงที่ปรากฏของอัตราการสลายตัวของฟีนอลด้วยไอลรอกซิลจาก 0 ถึง 0.62 มิลาร์ เนื่องจากการปรับปรุงความว่องไวของไทยเนียมไดออกไซด์ด้วยการเติมไอลรอกซิล เปอร์เซนต์ในช่วงความเข้มข้นถึง 0.62 มิลาร์ ทำให้เกิดการกระจายตัวของอนุมูลไอลรอกซิลที่

ใช้ในการออกซิไดร์และเกิดการรวมตัวกับอิเล็กตรอนในแบบการนำซึ่งเป็นลดการรวมตัวของอิเล็กตรอนกับหลุม ทำให้ปริมาณอนุมูลไயดรอกซิลในระบบสูงขึ้น

5.1.8 ผลของอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจนต่ออัตราการสลายตัวของฟีโนล

ผลของอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจนต่อค่าคงที่ปรากฏของอัตราการสลายตัวของฟีโนล ด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสง พบร่วมค่าคงที่ปรากฏของอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสงในการสลายฟีโนล มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราการไหลของออกซิเจนเพิ่มขึ้น เนื่องจากการป้อนออกซิเจนเข้าไปในระบบเป็นการเพิ่มปริมาณโมเลกุลออกซิเจนซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการรวมตัวกันของอิเล็กตรอนกับหลุม ผลสุดท้ายจะเกิดเป็นอนุมูลไயดรอกซิล ทำให้อัตราการสลายฟีโนลเพิ่มขึ้น

5.1.9 ผลของอุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาต่ออัตราการสลายตัวของฟีโนล

ผลของอุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาต่อค่าคงที่ปรากฏของอัตราการสลายตัวของฟีโนลด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสง พบร่วมค่าคงที่ปรากฏของอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสงในการสลายฟีโนล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น และค่าพลังงานกระตุ้นของระบบเท่ากับ $0.01 \text{ กิโลจูลต่อโมล}$ แสดงว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสงไม่ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยในช่วง ($20\text{-}80^\circ\text{C}$ องศาเซลเซียส) ผลของอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสงอาจเกิดมาจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนไปยังออกซิเจนหรือในอีกแห่งหนึ่ง คือ เกิดจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วระหว่างตัวรองรับ (substrate) และตัวกลาง (intermediate) จากไทเกเนียมไดออกไซด์ไดที่อุณหภูมิสูง ทำให้มีพื้นที่กว้างในการทำปฏิกิริยามากขึ้นเป็นผลให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสงได้ดีขึ้น

5.1.10 การคำนวณทางสถิติโดยใช้การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลสองระดับ

ลำดับของปัจจัยหลักที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการขัดฟีโนลโดยใช้การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลสองระดับมีดังนี้ กำลังของหลอดอัลตราไวโอเล็ต $>$ จำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเกเนียมไดออกไซด์ $>$ ความเข้มข้นของไயดรอเจนเปอร์ออกไซด์ $>$ ความเข้มข้นเริ่มต้นของฟีโนล ประสิทธิภาพในการขัดฟีโนลเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มกำลังของหลอดอัลตราไว

โอลี็ต บริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา และความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แต่เมื่อความเข้มข้นเริ่มต้นของฟีโนลเพิ่มขึ้นกลับทำให้ประสิทธิภาพในการขัดฟีโนลดลง

5.1.11 ภาวะที่เหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสง

จำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์เท่ากับ 8 แผ่น ความเข้มข้นเริ่มต้นของฟีโนลเท่ากับ 50 พีพีเอ็ม ความเป็นกรด-เบสเท่ากับ 5 ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เท่ากับ 0.62 มิลาร์ กำลังของหลอดอัลตราไวโอลี็ตเท่ากับ 135 วัตต์ อัตราการไหลของแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 200 มิลลิลิตรต่อนาที อุณหภูมิในการทำงานปฏิกิริยาเท่ากับ 30 องศาเซลเซียส มีอัตราการสลายฟีโนลได้สูงสุดถึง 7.2×10^{-3} นาที $^{-1}$ ซึ่งสามารถขัดฟีโนลได้ 91.4%

5.2 ข้อเสนอแนะ

- 5.2.1 ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่ได้สามารถประยุกต์ใช้ในการกำจัดอนุพันธ์ของฟีโนลิกตัวอื่นที่มีโครงสร้างไม่เลกูลที่ซับซ้อนมากขึ้น
- 5.2.2 ศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในการขัดฟีโนลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนพอลิเมทิลเมทาคริเลต โดยมีการขยายส่วนของเครื่องปฏิกรณ์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น